

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

セミコン・ジャパン 2007 出展のご案内

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区、社長:丸山利雄)は、2007年12月5日から3日間、幕張メッセにて開催されるセミコン・ジャパン 2007 に出展いたします。

当社は、「AT the Core of Testing」をテーマに、最新のテスト・ソリューションの数々をご紹介いたします。是非、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

会 期 : 2007年12月5日(水)~12月7日(金) 10:00am~5:00pm
会 場 : 幕張メッセ 展示ホール10 (ブース番号 10C-801)

開催詳細および事前入場登録につきましては、SEMI ジャパン公式サイトをご覧ください。

また、当社インターネット・ホームページでもセミコン・ジャパン 2007 出展について掲載しておりますのであわせてご覧ください。

SEMI ジャパンホームページ : <http://www.semi.org/>

当社ホームページ : <http://www.advantest.co.jp/>

【主な出展予定】

T2000 テスト・システム

ハイ・スピード I/F ソリューション

高速かつ多チャンネルのデバイス・インターフェースに特有な試験機能を搭載し、DI も含めたトータル・ソリューションを提供

ハイ・パラレル・ソリューション(NEW)

高密度デジタル・モジュールを搭載し 2,000 チャンネル超のテストを提案、高機能デバイスの同時測定でテスト・コストを削減

テスト・セル・ソリューション

テストからハンドラまでトータルでサポートするワン・ストップ・ソリューション。ダイナミック・テスト・ハンドラ「M4841」との組み合わせで、最大 16 個同時測定を実現した高スループットの MCU、DSP テスト・ソリューションを提供

RF ソリューション(NEW)

1モジュール 32 ポートの供給により、多ポート RF デバイスの低コスト試験を「T2000」テスト・システム上で実現

エンジニアリング・ソリューション

エンジニアリング・ユースや多品種少量生産に最適なテスト・ソリューション

*EDA リンケージ・ソフトウェア

ナノメータ時代の SoC テストにおける TAT 短縮及び歩留まり改善を実現するソフトウェア・ソリューション

LCD ドライバ・ソリューション

T6373 LCD ドライバ・テスト・システム (NEW)

次世代型高階調 LCD ドライバの多機能試験や低コスト試験を実現

Flash トータル・ソリューション

T5781 メモリ・テスト・システム (NEW)

MCP 向け業界最高速度 266MHz/533Mbps を実現、DRAM/Flash/MCP を 1 台で試験可能

T5781ES メモリ・テスト・システム (NEW)

「T5781」の機能を凝縮したエンジニアリング・ステーション・モデル新登場

T5761 メモリ・テスト・システム

NAND 型フラッシュ・メモリを最大 512 個同時測定、業界最高クラスの量産パフォーマンス

T5761ES メモリ・テスト・システム

「T5761」の機能を凝縮したエンジニアリング・ステーション・モデル

M6241 ダイナミック・テスト・ハンドラ (NEW)

高速ハンドリングによる高スループット化、多数個同時測定によるテスト・コスト低減

バーンイン・テスト・ソリューション

P3502 テスト・バーンイン・システム

低価格、高スループットでメモリ・デバイスの量産工程に貢献

EB リソグラフィ・ソリューション

F3000 電子ビーム露光装置

マスクレスで 65nm ノード以降の微細加工対応を実現

お客様お問合せ先

営業本部 販売推進部 03-3214-7500

本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。